

เพื่อความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในการขอรับบริการได้ที่ <http://thep-center.org>

ThEP-XPS-02

วันที่รับงาน.....จำนวนตัวอย่าง.....ตัว ตำแหน่งที่ต้องการวิเคราะห์ใน 1 ตัวอย่าง.....ตำแหน่ง*
 नामผู้ขอใช้บริการ.....นามหัวหน้าโครงการ(อ.ที่ปรึกษา).....
 ห้องปฏิบัติการวิจัย.....ศูนย์วิจัย/มหาวิทยาลัย/สถาบัน.....
 ที่อยู่.....
 เบอร์โทรศัพท์.....E-mail...../.....

นามและที่อยู่ที่ใช้ขอใบเสนอราคา (ถ้าต้องการ).....

 นามที่ใช้ขอใบเสร็จ.....

 นามและที่อยู่ที่ใช้ส่งใบเสร็จกลับ.....

เลือกลักษณะของการวิเคราะห์ (สามารถเลือกเป็นชุดหรือเลือกบางหัวข้อในแต่ละชุดได้)

<input type="radio"/> Surface Analysis* <input type="checkbox"/> Survey Spectrum <input type="checkbox"/> High Resolution <input type="checkbox"/> Export Raw Data <input type="checkbox"/> Component Analysis <input type="radio"/> Depth Profiling (กรุณาสอบถามข้อมูลด้วยตนเองกับเจ้าหน้าที่ก่อน) <input type="checkbox"/> Etch until reach substrate <input type="checkbox"/> Etch for time	<p><u>สำหรับเจ้าหน้าที่กรอก</u></p> <p>Ion Gun Energy.....eV Time per round.....sec.</p> <p>Etch area.....mm. Etch Cycle.....time</p> <p>Data Name</p>
---	--

หมายเหตุ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่รับบริการหลังจากนั้นจะถูกลบออกจากระบบฐานข้อมูล

กรณีต้องการทำ High Resolution กรุณาระบุธาตุที่ต้องการวิเคราะห์

1.....	3.....	5.....	7.....	9.....	11.....
2.....	4.....	6.....	8.....	10.....	12.....

กรณีตัวอย่างสกปรก หรือต้องการกำจัดผิวหน้าบางส่วนออก (ไม่แนะนำ)

☐ ใช้ Ion Gun ในการปรับผิว ☐ ไม่ใช้ Ion Gun ในการปรับผิว

กรณีเกิดปัญหา Auger Peak ทับซ้อนกับ Element Peak ในขณะทำการวิเคราะห์

☐ ใช้ Mg Gun เพื่อแก้ปัญหา Auger Peak ☐ ไม่สนใจ Peak ที่มีปัญหาทับซ้อนกับ Auger Peak
☐ ติดต่อกลับก่อนเพื่อหาทางแก้ไข ☐ ยกเลิกการวิเคราะห์ Sample ที่มีปัญหา Auger Peak

สำหรับเจ้าหน้าที่กรอก

ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์โดยประมาณ.....บาท
 กำหนดส่ง.....
 เงินมัดจำ(50%).....บาท ค่าส่ง.....บาท

รวมค่าบริการ..... บาท

ลงชื่อผู้ขอรับบริการ

.....
 (.....)

* หมายเหตุ

Survey Spectrum คือการวิเคราะห์ผิวโดยรวมซึ่งจะแสดงธาตุที่มีออกมาทั้งหมดในกราฟเดียว
High Resolution คือการเลือกวิเคราะห์ธาตุใดธาตุหนึ่งเช่น C, N, O เป็นต้น
Component Analysis คือการระบุว่าในธาตุนั้นๆ มีการรวมตัวกันอย่างไรบ้างทางเคมี (Chemical Bonding)และมีอยู่ที่เปอร์เซ็นต์และมีพลังงานเท่าไร
 ตำแหน่งวิเคราะห์ คือ ใน 1 ตัวอย่างขนาด 1x1 cm. สามารถวิเคราะห์สูงสุดได้ 2 บริเวณโดยที่อาจมีความเสี่ยงของการเกิด Overlap ของ X-ray Spot ได้ โดยปกติจะวิเคราะห์เพียง 1 จุดบริเวณตรงกลางของตัวอย่างหรือบริเวณที่ทำเครื่องหมายไว้เท่านั้น